

6-ая ШКОЛА «МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В НАНОТЕХНОЛОГИЯХ И НАНОИНДУСТРИИ»

4–7 ИЮНЯ 2013 г.

Екатеринбург

<http://school.rusnano-mc.com>

Организаторы

ФОНД ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА

При участии

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОСНАНО
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОФИЗИКИ УРО РАН

Цель школы

Школа является коммуникационной и образовательной площадкой, направленной на обсуждение актуальных проблем и повышение квалификации специалистов компаний nanoиндустрии, регулирующих органов, центров коллективного пользования, испытательных центров и лабораторий в области метрологического обеспечения производств, испытаний и сертификации продукции nanoиндустрии и стандартизации.

Тематика школы

- Российская и международная практика в области метрологии, сертификации и стандартизации продукции nanoиндустрии. Нормативное и методическое обеспечение nanoиндустрии РФ.
- Вопросы прикладной метрологии в nanoиндустрии: разработка и применение методов и средств измерений в производственных процессах и контроле качества продукции.
- Характеризация перспективных наноматериалов и наноструктур разных типов современными методами измерений.

Программа Школы будет включать ключевые лекции (40 мин), устные (15-20 мин) и стендовые доклады.

Также в рамках школы будут представлены презентации современного исследовательского и метрологического оборудования для nanoиндустрии от ведущих производителей.

Рабочий язык школы: русский

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Свинаренко А.Г.	сопредседатель , Фонд инфраструктурных и образовательных программ
Кокшаров В.А.	сопредседатель , Уральский федеральный университет
Иванов В.В.	Метрологический центр РОСНАНО
Богач С.В.	Метрологический центр РОСНАНО
Ткачук Ю.Г.	Фонд инфраструктурных и образовательных программ
Чолах С.О.	Уральский федеральный университет
Шунайлов Е.А.	Институт электрофизики УрО РАН
Сухарев В.С.	секретарь , Метрологический центр РОСНАНО

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Иванов В.В.	сопредседатель , Метрологический центр РОСНАНО, Москва
Булыгин Ф.В.	сопредседатель , Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Москва
Мушников Н.В.	сопредседатель , Уральское отделение РАН, Екатеринбург
Алымов М.И.	Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, Черноголовка
Бредихин С.И.	Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка
Бухтияров В.И.	Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск
Васильев А.Л.	НИЦ «Курчатовский институт», Москва
Голубев С.С.	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Москва
Калюжный С.В.	ОАО «РОСНАНО», Москва
Кашкаров П.К.	НИЦ «Курчатовский институт», Москва
Киселев Н.А.	Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН, Москва
Кортов В.С.	Уральский федеральный университет, Екатеринбург
Крутиков В.Н.	ФГУП «ВНИИОФИ», Москва
Латышев А.В.	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
Лахов В.М.	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Москва
Левашов Е.А.	НИТУ «МИСиС», Москва
Медведевских С.В.	ФГУП «УНИИМ», Екатеринбург
Озерин А.Н.	Институт синтетических полимерных материалов РАН, Москва
Окрепилов В.В.	ФГУ «Тест – С.-Петербург», Санкт-Петербург
Попов А.А.	Уральский федеральный университет, Екатеринбург
Пушин В.Г.	Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург
Ремпель А.А.	Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург
Ринкевич А.Б.	Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург
Рычков В.Н.	Уральский федеральный университет, Екатеринбург
Ткачук Ю.Г.	Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Москва
Тодуа П.А.	Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума, Москва
Чолах С.О.	Уральский федеральный университет, Екатеринбург
Шпак В.Г.	Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург

Регистрация

Для участия в школе необходимо зарегистрироваться на сайте <http://school.rusnano-mc.com>

Сумма оргвзноса участника школы составляет 7000 руб. Для сотрудников бюджетных научных и образовательных организаций – 5000 руб. Для студентов и аспирантов – 2000 руб. Оргвзнос включает оплату за программу, сборник тезисов школы и другие информационные материалы, портфель участника, обеды, кофе-брейки. Взнос оплачивается путем перечисления денежных средств на счет школы (подробности оплаты на сайте школы). Срок оплаты оргвзноса – **до 15 мая 2013 года**.

Представление материалов

Участникам школы предлагается выступить с устными (15-20 мин) или стендовыми докладами по тематике школы. В содержание докладов необходимо включить описание основных физико-технических параметров, достаточно полно характеризующих технологические процессы и формируемые объекты, с указанием целесообразных погрешностей их измерения, обозначить методы измерения и виды рекомендуемого измерительного оборудования. Лучшие устные и стендовые доклады будут отмечены программным комитетом специальными призами.

Тезисы докладов объемом 1 - 2 страницы, рисунки и список литературы набираются в формате А4 с полями 2,5 см. Редактор – Word for Windows. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта 12 pt, междустрочный интервал – полуторный. За названием доклада (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ) следуют фамилии авторов с верхними индексами, если они работают в разных организациях (буквы строчные), затем – названия организаций и E-mail докладчика (буквы строчные, курсив). Фамилию и инициалы докладчика необходимо подчеркнуть. Инициалы должны следовать за фамилиями авторов. Тезисы должны быть представлены в Оргкомитет не позднее **25 марта 2013** года через сайт или по электронной почте school@rusnano-mc.com . Файлы следует называть полной транслитерированной фамилией представляющего автора, напр., Kovalev.doc

Место проведения и проживание

Школа проводится на базе Уральского федерального университета (Екатеринбург).

Контактная информация:

По вопросам регистрации и общим вопросам:

Сухарев Валентин Сергеевич

Тел.: +7 495 988 5388, доб. 1566

E-Mail: school@rusnano-mc.com, valentin.sukharev@rusnano-mc.com

По вопросам оплаты оргвзноса:

Савушкина Ольга Васильевна

Тел.: +7 495 988 5388, доб. 1961

E-Mail: olga.savushkina@rusnano-mc.com

КЛЮЧЕВЫЕ ЛЕКЦИИ

Авилов Анатолий Сергеевич

Заведующий Отделом электронной кристаллографии, д.ф.-м.н., Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН, Москва

ЭЛЕКТРОННАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИФРАКТОМЕТРИЯ В СТРУКТУРНОЙ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ РАЗМЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ НАНОЧАСТИЦ

Алымов Михаил Иванович

чл.-корр. РАН, директор ИСМАН, Черноголовка

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И СВОЙСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОРОШКОВЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ

Васильев Александр Леонидович

к.ф.-м.н., зав. лабораторией электронной микроскопии НИЦ «Курчатовский институт», Институт кристаллографии РАН, Москва

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТРЕХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Гавриленко Валерий Петрович

профессор, зам. ген. директора по научной работе НИЦПВ, Москва

НАНОМЕТРОЛОГИЯ – КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Захаров Дмитрий Николаевич

Brookhaven National Laboratory, США

ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ С ВЫСОКИМ ВРЕМЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ.

Александр В. Квит

профессор, Университет Висконсин – Медисон, США

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ МЕТОДОМ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Козлова Нина Семеновна

к.ф.-м.н., зав. лаб., НИТУ «МИСиС», Москва

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ В РАБОТЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ.

Кортов Всеволод Семенович

профессор, Уральский федеральный университет, Екатеринбург

Вайнштейн Илья Александрович

д.ф.-м.н., руководитель НОЦ «НАНОТЕХНОЛОГИИ», Уральский федеральный университет, Екатеринбург

ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ В НОЦ «НАНОТЕХНОЛОГИИ» И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В УРФУ ПО МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.

Крутиков Владимир Николаевич

д.т.н., директор ФГУП "ВНИИОФИ", Москва

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Латышев Александр Васильевич

чл.-корр. РАН, зам. директора ИФП СО РАН, Новосибирск

РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ НАНОМАТЕРИАЛОВ В ЦКП «НАНОСТРУКТУРЫ»

Левин Геннадий Генрихович

д.т.н., профессор, руководитель НИО «Голографии и оптической томографии» ВНИИОФИ, Москва

СВЕРХРАЗРЕШЕНИЕ В ОПТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ ПРИ АНАЛИЗЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Dietmar Lerche

Professor, LUM GmbH, Германия

CHARACTERIZATION OF DISPERSIONS STABILITY AND CONTROL OF DISPERSIBILITY. APPLICATIONS OF ANALYTICAL CENTRIFUGATION.

Лопатин Сергей Юрьевич

PhD, ведущий специалист по прикладным исследованиям, Application Laboratory FEI, Нидерланды
ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ: ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ.

Панева Вера Ивановна

к.т.н. Зав. лабораторией метрологического обеспечения количественного химического анализа, УНИИМ, Екатеринбург

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

Петржик Михаил Иванович

к.т.н., в.н.с., НИТУ «МИСиС», Москва

НА ПУТИ К УНИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НАНОМАТЕРИАЛОВ.

Попов Артемий Александрович

профессор, д.т.н., зав. кафедрой термообработки и физики металлов, Институт материаловедения и металлургии УрФУ, Екатеринбург

ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ: СТРУКТУРА, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ

Пушин Владимир Григорьевич

д.ф.-м.н., профессор, Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ И СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ СПЛАВОВ С ТЕРМОУПРУГИМИ МАРТЕНСИТНЫМИ ПРЕВРАЩЕНИЯМИ И ЭФФЕКТАМИ ПАМЯТИ ФОРМЫ

Ремпель Андрей Андреевич

чл.-корр. РАН, профессор, д.ф.-м.н., зав. лабораторией нестехиометрических соединений Института химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ НАНОЧАСТИЦ МЕТОДАМИ МАЛОУГЛОВОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ

Ринкевич Анатолий Брониславович

д.ф.-м.н., заместитель директора по научной работе Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ИСПЫТАНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ В ЦКП ИНСТИТУТА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ УРО РАН

Соковнин Сергей Юрьевич

в.н.с., д.т.н. Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ

Степанов А.С.

ФГУП "УНИИМ", Екатеринбург

СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ. РОЛЬ ПРОЦЕССОВ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ

Толмачев Владимир Валерьянович

зав.лаб. "Менеджмент риска и оценка соответствия" ФГУП "УНИИМ", Екатеринбург

ОЦЕНКА РИСКА И СЕРТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ, МАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКЦИИ НАНОИНДУСТРИИ

Чвалун Сергей Николаевич

д.ф.-м.н., проф Нач отдела НИЦ «Курчатовский институт», Москва

ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпаков С.В.

ФГУП "УНИИМ", Екатеринбург

ПРОВЕРКА КВАЛИФИКАЦИЙ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ